

TÉMATA STUDENTSKÝCH PRACÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2011–12

Rámcové téma práce č. 59: Mikroskopická měření vlastností nanostrukturních křemíkových tenkých vrstev

Typ práce: BP, VÚ

Možné zaměření: FE, FN, OF

Vedoucí práce, konzultant: Ing. A. Fejfar (FZÚ AV), doc. Ing. I. Richter, Dr.⁶⁸

Počet studentů: 1

Abstrakt: Křemíkové tenké vrstvy mohou mít velmi rozdílnou nanostrukturu, která ve výsledku rozhoduje o aplikacích. Cílené využití nanostruktur vyžaduje možnost měření elektronických vlastností s odpovídajícím rozlišením. BP bude zaměřena na AFM v různých módech. Cílem práce je nalézt vhodné módy pro měření na směsných křemíkových vrstvách nebo na křemíkových nanodrátech.

⁶⁸<mailto:ivan.richter@fjfi.cvut.cz>